

GEMINI X

Microscopy Hyperspectral Imaging Module

お手持ちの顕微鏡を高感度ハイパースペクトル顕微鏡に

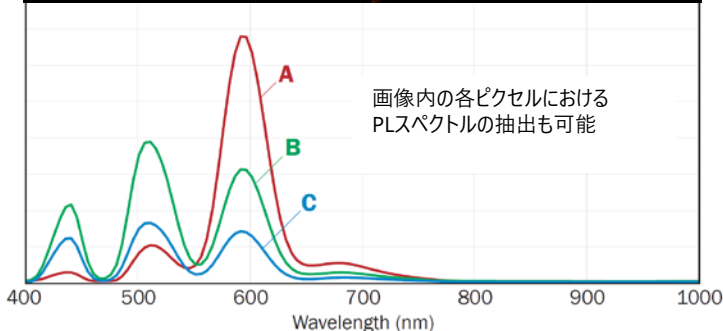
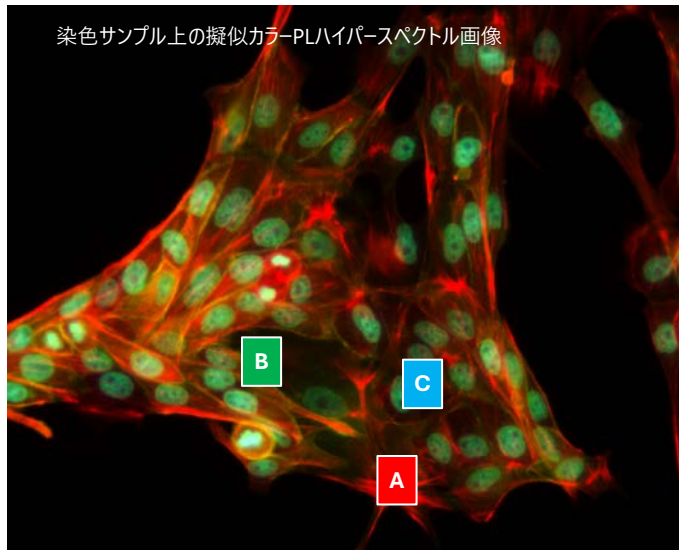
Gemini-X は、NIREOS独自のTWINS干渉計技術を用いた顕微鏡向けフーリエ変換型ハイパースペクトルイメージング・モジュールです。お手持ちの顕微鏡カメラと組み合わせることで高感度のハイパースペクトルイメージを取得できます。PLや蛍光など微弱発光の広帯域分光イメージングに最適です。

■ Full-Field ハイパースペクトル
画像全体を同時取得
各画素ごとのスペクトルを取得

■ 高感度 フーリエ変換方式
スリット損失なし
高SNR・微弱PL測定に最適

■ 顕微鏡へ後付け可能
各社顕微鏡に対応
各種カメラ対応

■ TWINS共通光路干渉計
高い安定性
振動・温度変動に強いFT分光



Technical specifications

Spectral range*	400 - 1700 nm (options down to UV or in the IR available)*
Clear Aperture	Ø 20 mm
User adjustable spectral resolution	<1 nm @ 400 nm <15 nm @ 1700 nm
Number of spectral bands	Selectable via Software**
Software Package	For Hyperspectral Imaging: Acquisition App & HyperLAB
	For TRES measurements: TRES App (compatible with most TCSPC cards)
Dimensions	176 × 44 × 55 mm
Weight	0.5 kg
Recommended System Requirements (for optimal operation of HyperLAB)	32 GB RAM, SSD drive suggested

*標準仕様のGEMINI-Xは、400～1700 nmのスペクトル範囲でARコーティングされた光学系を備えています。その他のスペクトル範囲向けには、別のコーティングもご用意しております。詳細についてはお問い合わせください。

**GEMINI-Xはフーリエ変換分光法（FT-S）に基づく装置であり、抽出するスペクトルバンド数はニーズに応じて選択可能です。異なるスペクトル分解能（およびバンド数）を提供するプリセットスキャンモードは、Acquisition Appソフトウェアで利用できます。GEMINI-Xはチューブレンズの後ろにある顕微鏡のダブテールに接続します。GEMINI-Xを挿入するにはダブテールと像焦点面との間に十分なスペースが必要です。詳細についてはお問い合わせください。

Benefits

微弱PL・材料解析に最適

FT方式の高スループットにより

- ・ 微弱発光
- ・ 欠陥発光
- ・ 波長シフト
- ・ 材料不均一性

を高感度に解析可能。

TWINS技術による高安定性

NIREOS独自のTWINS（共通光路干渉計common-path interferometer）により

- ・ 高い位相安定性
- ・ 高い再現性
- ・ 長時間測定安定性

を実現。

Application

顕微PL
Raman imaging
半導体解析
2D材料
ペロブスカイト
Microplastic解析
バイオ蛍光
反射/透過ハイパースペクトルイメージング

Accessories

顕微鏡用メカニカルアダプター
カメラ接続用チューブ

